

表面探傷スコープ™ (Surface Flaw Detection Scope™)

参考出品

東芝特許技術「OneShotBRDF®」使用

表面探傷スコープ™



特長

- 1: フラット面に付いた観測困難な微小傷を可視化
- 2: 多波長同軸開口による散乱光識別で高速検査
- 3: 画像識別困難なキズでも色で識別

仕様 (参考値)

- :: 測定視野： $\Phi 40\text{mm}$
- :: 最小傷： 数 $10\mu\text{m}$

ガラス表面傷

普通紙

光沢紙

散乱 (赤)

正反射 (青)

搭載カメラ：BU2409MCF仕様

- 1: 撮像デバイス：Sony 製 IMX540
- 2: 解像度：2,447万画素 (5,320×4,600画素)
- 3: 画素サイズ：2.74 μm × 2.74 μm
- 4: インターフェース：USB3.2 Gen.1



※ OneShotBRDFは、東芝情報システム株式会社の登録商標です。